

## 10uF/6.3V电容热冲击验证报告

一、客户乐鑫反馈ESP32-SIG1711P8试产模块可靠性试验中发现C10位电容有击穿现象。



二、参考乐鑫可性试验

1、在温度85℃、湿度85%环境存贮196H

2、在温度85℃，湿度85%模拟工作196H

三、相同试验条件，试验有三种规格物料分别是

A、10UF/6.3V电容，村田（Murata）GRM155C80J106ME11D（新物料）

B、1UF/10V电容，村田（Murata）GRM033C81A105ME05D（新物料）

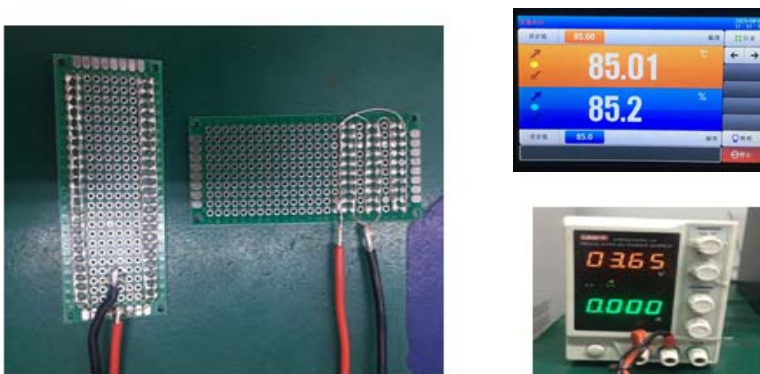
C、0.1UF/6.3V电容，三星（Samsung）CL05B104KO5NNNC

四、模拟试验

4.1、将产品模拟在温度85℃、湿度85%环境存贮



4.2、将产品模拟在温度85℃、湿度85%环境工作



## 五、试验验证结果

### 5.1 试验条件及试验时间

[illegible]

5.2、10uF/6.3V在温度85℃,湿度85模拟运行,出现漏电现象。(试验数量为50PCS,有1PCS出在漏电现象)

5.2、其它两种规格物料没出现漏电现象。